	ว่าย) กลุ่มที่	_ ชั้นปีที่ห้อง			j/	/
รหัส	ชื่อ		รหัส	ชื่อ		
				ภาควิชาวิศวกรรมคอม สถาบันเทคโนโลยีพระจ		
<u>การทด</u>	<u>ลองที่ 5</u> Diode: Cha	racteristics and App	olications (rev.	04)		
<u>วัตถุประ</u>	<u>ะสงค์</u>					
1.	เพื่อหาลักษณะสมบัติขอ	งไดโอด				
2.	เพื่อหาความต้านทานขณ	ะไบอัสตรงและไบอัสกลับ	เของไดโอด			
3.	เพื่อศึกษาวงจรกำเนิดไฟ	ฟ้ากระแสตรง				
อุปกรณ์	เพิ่มเติม					
1	. ไม่มี					
<u>วัสดูเพิ่ม</u>	ແຕີນ					
1.	 เทปพันสายไฟ (นักศึกเ	ษาจัดหามาเอง)				

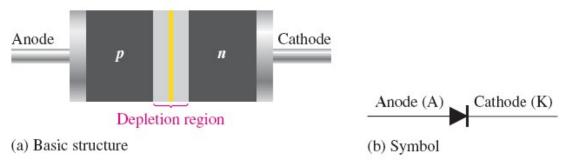
- 5.1 Diode checking with DMM
- 5.2 Diode Characteristic
- 5.3 Half wave rectifier
- 5.4 Full wave rectifier

วัสดุเหล่านี้ เมื่อทดลองเสร็จให้เก็บให้เรียบร้อย เพื่อใช้ในการทดลองครั้งต่อไป

เต็ม 10 คะแนน

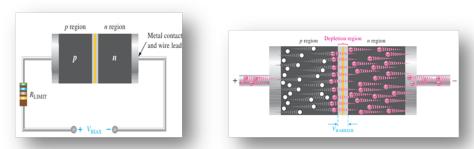
<u>ทฤษฎี</u>

ไดโอดเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำ p-n สามารถควบคุมให้กระแสไฟฟ้าจากภายนอกไหลผ่านตัวมันได้ทิศทางเดียว ไดโอด ชนิดสารกึ่งตัวนำ มักจะใช้ผลึกสารกึ่งตัวนำจำพวกซิลิกอนที่ไม่บริสุทธิ์โดยทำการเจือสาร (Dope) ให้เกิดสารกึ่งตัวนำสองชนิดโดยชนิดแรก จะมีประจุลบคืออิเล็กตรอนมากกว่าโฮลเรียกว่า "สารกึ่งตัวนำชนิด n (n-type semiconductor) " ส่วนอีกชนิดหนึ่งนั้นจะมีประจุบวก หรือโฮลมากกว่าอิเล็กตรอนเรียกว่า "สารกึ่งตัวนำชนิด p (p-type semiconductor) " ดังนั้นไดโอดจึงมีขั้ว 2 ขั้ว คือ แอโนด (Anode ; A) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด p และ แคโธด (Cathode ; K) ซึ่งต่ออยู่กับสารกึ่งตัวนำชนิด n โดยมีโครงสร้างและสัญลักษณ์ดังรูปที่ 1 (a) และ (b) ตามลำดับ



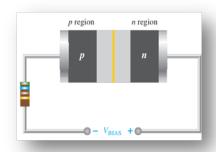
การไบอัส (BIAS)

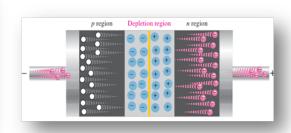
การไบอัสเป็นการป้อนแรงดันไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เพื่อให้ทำงานตามที่ผู้ออกแบบต้องการ โดยการไบอัสรอยต่อ p-n เป็นการป้อน สนามไฟฟ้าภายนอกให้แก่รอยต่อ ซึ่งมีผลต่อบริเวณปลอดพาหะ ซึ่งสามารถทำได้สองแบบ คือ การไบอัสตรง (Forward Bias)และการ ไบอัสกลับ (Reverse Bias)



การไบอัสตรงแก่รอยต่อ p-n โดยการป้อนศักย์ไฟฟ้าบวกแก่สารกึ่งตัวนำ p-type และการป้อนศักย์ลบให้กับสารกึ่งตัวนำ n-type ซึ่งจะผลักให้พาหะข้างมากเข้าหารอยต่อ ทำให้บริเวณปลอดพาหะแคบลง หากศักย์ไฟฟ้าที่ป้อนนี้มีค่าสูงกว่ากำแพงศักย์ไฟฟ้าภายใน รอยต่อ ก็จะเกิดกระแสไฟฟ้าไหลผ่านรอยต่อได้ ซึ่งศักย์ไฟฟ้าที่รอยต่อของรอยต่อ p-n ที่สร้างจาก Ge มีค่าประมาณ 0.3V และ Si จะมีค่าประมาณ 0.7 V ที่ 25 องศาเซลเซียส

กลุ่ม(เช้า-บ่าย) ____ กลุ่มที่ ___ ชั้นปีที่ ___ ห้อง ___ วันเดือนปี ___ /___ / ____ รหัส _____ ชื่อ _____ รหัส ____ ชื่อ





การไบอัสกลับแก่รอยต่อ p-n โดยป้อนศักย์บวกแก่สารกึ่งตัวนำ n-type และศักย์ลบให้กับสารกึ่งตัวนำ p-type ซึ่งจะดึงดูดให้ พาหะข้างมากเข้าหาศักย์ไฟฟ้าที่ป้อน จึงทำให้บริเวณปลอดพาหะกว้างยิ่งขึ้น อนึ่งการไบอัสกลับนี้ไม่ขัดขวางการเคลื่อนที่ของพาหะข้าง น้อย

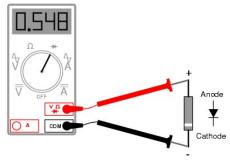
การทดลองที่ 5.1 การทดลองวัดค่าของไดโอดด้วย DMM

1) ทำการวัดค่าไดโอดโดยปรับ DMM (Digital Multi Meter) ไปยังย่านวัดไดโอด ตามรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงย่านการวัดไดโอด

2) ทำการต่อดิจิตอลมัลติมิเตอร์(DMM)เข้ากับไดโอดตามรูปที่ 2



รูปที่ 2 การวัดไดโอดโดยใช้ดิจิตอลมัลติมิเตอร์

กลุ่ม(เช้า-บ่าย)	กลุ่มที่	ชั้นปีที่ห้อง		วันเดือนปี .	/_	/	_
รหัส	ชื่อ		รหัส	ชื่อ			

- 3) ทำการบันทึกผลค่าที่วัดได้จากรูปที่ 2 โดยที่สายวัดสีแดงวัดที่ขั้วอาโนดและสายสีดำวัดที่ขั้วคาโทด (Forward bias) ถ้าหน้าจอของ DMM ขึ้นดังรูปที่ 1 ให้บันทึกเป็น over range
- 4) ทำการบันทึกผลค่าที่วัดได้จากรูปที่ 2 โดยที่<u>สายวัดสีแดงวัดที่ขั้วคาโทดและสายสีดำวัดที่ขั้วอาโนด</u> (Reverse bias)

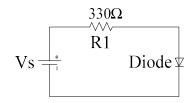
NO.	Diode	Reverse Bias	Forward Bias
1	1N4001 #1		
2	1N4001 #2		
3	1N4001 #3		
4	1N4001 #4		

- ถ้าเราวัดไดโอด แล้วพบว่า มีความต้านทานน้อยทั้ง Forward และ Reverse แสดงว่า
- ถ้าเราวัดไดโอด แล้วพบว่า มีความต้านทานมากทั้ง Forward และ Reverse แสดงว่า

การทดลองที่ 5.2 การทดลองตรวจสอบคูณสมบัติของไดโอด

<u>ขั้นตอนการทดลอง</u>

- 1) วัดค่ารีซิสเตอร์ R_1 ด้วย DMM ค่าที่ได้คือ Ω
- 2) ใช้มิเตอร์วัดโวลเตจที่ตกคร่อมไดโอด (V_{Diode} ใช้ Range 2V) ปรับ Vs ให้ได้ V_{Diode} ตามตาราง
- 3) ใช้ DMM วัดค่า Voltage ที่ตกคร่อม R1 บันทึกผล และคำนวณกระแส



No	$V_{ ext{Diode}}$	Vs (Volt)	V _{R1} (Volt)	i=V _{R1} /R1 (mA.)
1	0.45 V			
2	0.50 V			
3	0.55 V			
4	0.60 V			
5	0.65 V			
6	0.70 V			
7	0.75 V			

กลุ่ม(เช้า-บ่าย)	กลุ่มที่	ชั้นปีที่ห้อง		วันเดือนปี	/_	/_	
รหัส	ชื่อ		รหัส	ชื่อ			

ดโอด บันทึกผล			

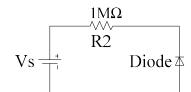
4) ตั้งค่า Vs = 20 V. วัดอุณหภูมิที่ไดโอด นำหัวแร้ง(เพิ่มอุณหภูมิให้ไดโอด) มาจ่อใกล้ๆ สังเกตุการเปลี่ยนแปลงโวลเตจที่ตกคร่อม

5) วัดค่า Resistor 1MΩ ด้วย DMM

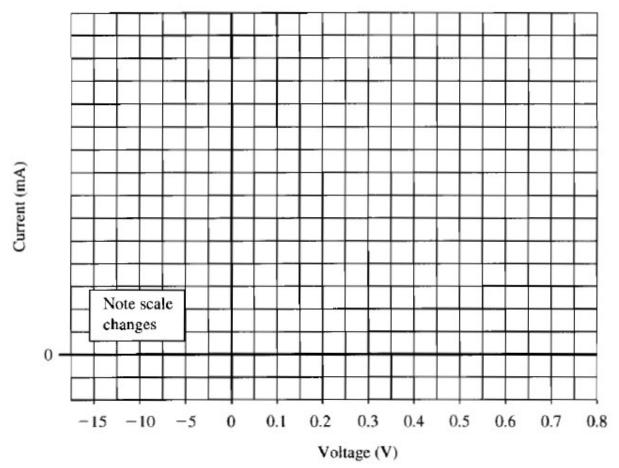
1		
। ସଂଏହସ		
คาทไดค์ก	(_
WI I VI LUIWIPI		٠.

6) ต่อวงจรดังรูป ปรับค่า Vs ให้ได้ Voltage ตกคร่อม R2 ดังตาราง

VR2	V_{REV}	I _{REV}
(measured)	(measured)	(computed)
5.0 V.		
10.0 V.		
15.0 V.		



7) นำข้อมูลที่ได้มาพล็อตกราฟ

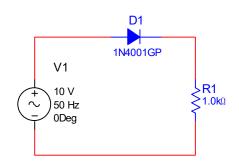


กลุ่ม(เช้า-บ่าย)	ุ กลุ่มที่	ชั้นปีที่	_ห้อง		วันเดือนปี _	/_	/	/
รหัส	ชื่อ			รหัส	ชื่อ			

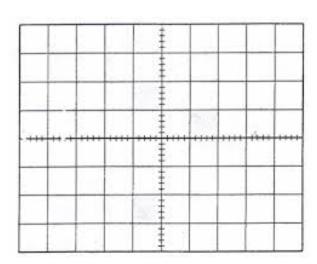
การทดลองที่ 5.3 การทดลองการวงจรเรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-Wave Rectifier)

ขั้นตอนการทดลอง

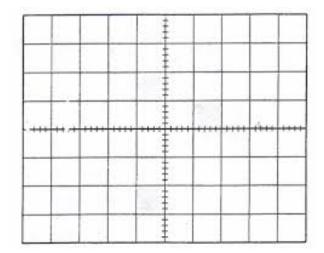
- 1) ใช้ CH1 ของออสซิสโลสโคป (DC coupling) ตั้งค่า sine wave ให้ได้ 10 Vpp 50 Hz.
- 2) ต่อวงจรดังรูป ใช้ CH2 ของออสซิสโลสโคป (DC coupling) วัดสัญญาณโวลเตจที่ตกคร่อมรีซิสเตรอ์ (V_{R1}) และ โวลเตจที่ตกคร่อมไดโอด (V_{D} ใช้ Range 2V)



3) วาดรูปสัญญาณ ของทั้งสอง channel (ต้องระบุ ground ของแต่ละ channel ด้วย)



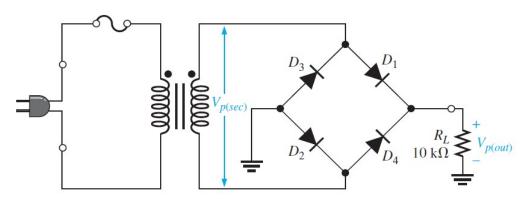
4) ถอด probe ทั้งสอง ออกจากวงจร แล้วนำ probe CH1 วัด Voltage ที่ตกคร่อมไดโอด โดยให้ ground ของ probe อยู่ที่จุดเชื่อม ต่อระหว่าง ไดโอด และ รีซิสเตอร์



กลุ่ม(เช้า-บ่าย)	กลุ่มที่	ชั้นปีที่ห้อง		วันเดือนปี _	/_	/	
รหัส	ชื่อ		รหัส	ชื่อ			

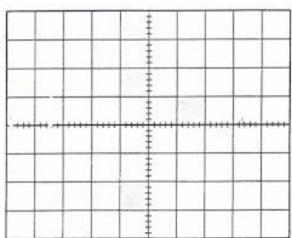
การทดลองที่ 5.4 การทดลองการวงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์ (Bridge Rectifier)

ขั้นตอนการทดลอง

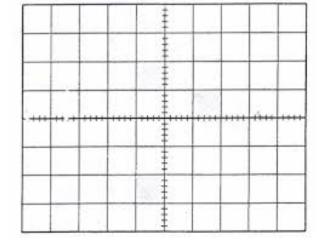


- 1) ต่อวงจรดังรูป
- 2) ใช้ CH1 ของออสซิสโลสโคป (DC coupling) วัดค่า $V_{p(sec)}$ บันทึกผล

 $CH1 = \dots V / div$ Timebase =s/div Vmax (CH1) = Volts. Vmin (CH1) = Volts. Frequency = Hz.



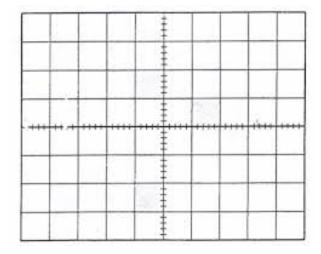
- 3) ใช้ CH1 วัด Voltage ตกคร่อม D3 โดยให้ ground ของ probe อยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่าง D3 และ D4
- 4) ใช้ CH2 วัด Voltage ตกคร่อม D2 โดยให้ ground ของ probe อยู่ที่จุดเชื่อมต่อระหว่าง D3 และ D4 บันทึกผล



ปีการศึกษา 1/2560

กลุ่ม(เช้า-บ่าย)	กลุ่มที่	ชั้นปีที่ห้อง		วันเดือนปี _	/	 /
รหัส	ชื่อ		รหัส	ชื่อ		

- 5) ถอด probe ออกทั้งสอง channels
- 6) ใช้ CH1 วัด Voltage ตกคร่อม R_L ($V_{p(out)}$)



7) นำคาปาซิเตอร์ 1uF ต่อขนานกับ RL โดยให้ขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ต่อกับจุด V+ และ ขั้วลบ ต่อกับ Ground

CH1 scale = V / div

Timebase = s/div

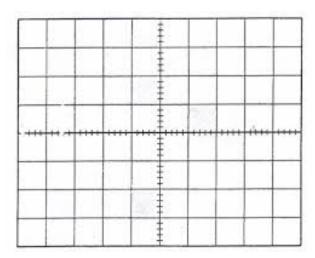
Vmax (CH1) = Volts.

Vmin (CH1) = Volts.

Vripple = Vmax - Vmin

=-

= Volt



8) นำคาปาซิเตอร์ 100uF ต่อแทน 1uF ขนานกับ RL โดยให้ขั้วบวกของคาปาซิเตอร์ต่อกับจุด V+ และ ขั้วลบ ต่อกับ Ground

CH1 scale = V / div

Timebase = s/div

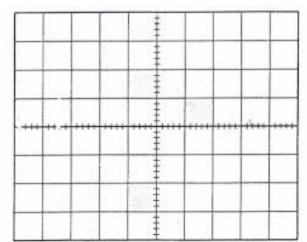
Vmax (CH1) = Volts.

Vmin (CH1) = Volts.

Vripple = Vmax - Vmin

=- -

= Volt



ปีการศึกษา 1/2560

กลุ่ม(เช้า-บ่าย)	กลุ่มที่	ชั้นปีที่ห้อง		วันเดือนปี	/	/	
รหัส	ชื่อ		รหัส	ชื่อ			

F	AI	RC	IIL	
SE	EMIC		CT	

1N4001 - 1N4007

Features

- · Low forward voltage drop.
- · High surge current capability.



General Purpose Rectifiers

Absolute Maximum Ratings*

T_A = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Value							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V_{RRM}	Peak Repetitive Reverse Voltage	50	100	200	400	600	800	1000	V
I _{F(AV)}	Average Rectified Forward Current, .375 " lead length @ T _A = 75°C	1.0							Α
FSM	Non-repetitive Peak Forward Surge Current 8.3 ms Single Half-Sine-Wave	30					Α		
T _{stg}	Storage Temperature Range	-55 to +175				°C			
TJ	Operating Junction Temperature	erature -55 to +175				°C			

^{*}These ratings are limiting values above which the serviceability of any semiconductor device may be impaired.

Thermal Characteristics

Symbol	Parameter	Value	Units
P _D	Power Dissipation	3.0	W
Roja	Thermal Resistance, Junction to Ambient	50	°C/W

Electrical Characteristics T_A = 25°C unless otherwise noted

Symbol	Parameter	Device							Units
		4001	4002	4003	4004	4005	4006	4007	
V _F	Forward Voltage @ 1.0 A				1.1				V
lπ	Maximum Full Load Reverse Current, Full Cycle T _A = 75°C	30						μА	
R	Reverse Current @ rated V _R T _A = 25°C T _A = 100°C		5.0 500						
Ст	Total Capacitance V _R = 4.0 V, f = 1.0 MHz				15				pF

